

動的タイム・ボローイングを可能にするクロッキング方式の適用手法

広畑 壮一郎¹ 吉田 宗史¹ 倉田 成己¹ 五島 正裕¹ 坂井 修一¹

概要：

半導体プロセスの微細化に伴う回路遅延のばらつきが増加が、回路設計における大きな問題となりつつある。ばらつきが増大していくと、従来のワースト・ケースに基づいた設計手法は悲観的になりすぎる。そのため、ワースト・ケースより実際に近い遅延に基づいた動作を実現する手法が提案されている。我々は動的なばらつき対策手法としてのタイミング・フォールト検出を、二相ラッチのクロッキング方式に組み合わせることによって実現される、動的タイム・ボローイングを可能にするクロッキング方式を提案する。本手法によって、動作時にステージ間で回路遅延を融通し、実効遅延に近い速度で動作させることが可能になる。本稿では、通常の回路を提案手法を適用した回路に変換するツールを実装する。提案手法では従来の単相 FF 方式と比べて最大 2 倍の動作周波数の向上を達成できる。

1. はじめに

半導体プロセスの微細化に伴って、素子遅延のばらつきが大きな問題となりつつある。ここで特に問題とされているのは、チップ間に跨るシステムティックなばらつきではなく、チップ内のランダムなばらつきである。これは、トランジスタや配線のサイズが原子のサイズに近づくために生ずる本質的な問題であり、原理的に避けえない。

ばらつきが増大していくと、従来のワースト値に基づいた設計手法は悲観的になりすぎる。微細化が進むにつれて、ばらつきが増大により、平均値とワースト値の差は広がっていく。その結果、LSI の設計上の動作速度が向上しなくなってしまうことも考えられる。

そのため、ワースト・ケースより実際に近い遅延に基づいた動作を実現する手法が提案されている。設計段階において遅延のばらつきを統計的に扱う SSTA (Statistic Static Timing Analysis: 統計的静的タイミング解析) などその一例である。SSTA によれば、ワースト・ケースほど悲観的ではない遅延見積もりを行うことができる。

動的タイミング・フォールト検出・回復

SSTA のように、設計時に用いられる手法は、静的な方法ということができる。それに対して、動作時にタイミング・フォールトを検出し回復する手法は、動的な方法とい

うことができる。

タイミング・フォールト (以下、TF と略す) は、遅延の動的な変化によって設計者の意図とは異なる動作が引き起こされる過渡故障である。想定した動作条件内のワースト・ケースでも動作するように設計するのがワースト・ケース設計であるので、そのように設計・製造された LSI では、原則 TF は発生しない。実際に TF が起こるのは、想定した動作条件を外れた場合、例えば、冷却ファンや温度センサの故障による熱暴走などに限られる。

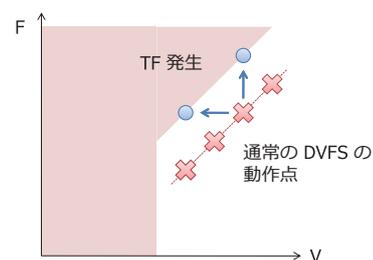


図 1 Razor と DVFS の組み合わせによる V/F の改善

Razor [1] は、TF を検出する機能を持つ。このような回路に DVFS (Dynamic Voltage and Frequency Scaling) を組み合わせると、見積もりではない、実際の遅延に応じた動作を実現することができる。図 1 にその様子を示す。V (Voltage: 電源電圧) を下げる、または、F (Frequency: 動作周波数) を上げると、回路はいずれ TF を生じ、検出される。検出直前の V-F が、見積もりではない、そのチップのその時の動作環境における実際の遅延に応じた V-F

¹ 東京大学 大学院 情報理工学系研究科
Graduate School of Information Science and Technology,
The University of Tokyo

である。後は、TF が頻発しないように V-F を調整すればよい。

既存手法の限界

このような TF 検出手法はしかし、実際には、プロセスばらつきに対する直接的な解法にはなっていない。

クリティカル・パスが活性化される確率が 1/100 程度である [2] とすると、クリティカル・パスの遅延より V-F を改善することは現実的ではない。クリティカル・パスの遅延以上に V-F を改善すると、100 サイクルに 1 回は TF を生じ、回復のペナルティを被るからである。

ここで、クリティカル・パスの遅延にはプロセスばらつきの影響が含まれていることに注意されたい。チップ内の各クリティカル・パスの遅延はランダムばらつきにより増減するが、チップの V-F は最も増大した遅延によって決まるのである。

結局、TF 検出手法の効果とは、DVFS のマージンを削減することとすることができる。

本稿の提案

多数の法則が示すように、あるパスを構成するゲート段数が増加していくと、パスの遅延は構成する個々のゲートの典型的遅延の総和に近づく。すなわち、パスが十分に多段であれば、ばらつきの影響は無視できるようになるのである。

本稿で提案するのは、端的に言えば、TF 検出と二相ラッチを組み合わせたクロッキングの方式である。このことにより、動的タイム・ボローイングが可能になる。後で詳しく述べるが、従来からある二相ラッチ方式で可能になるタイム・ボローイングは、言わば静的タイム・ボローイングと呼べるもので、設計時にステージ間で回路遅延を融通する。融通される回路遅延は、ワースト遅延である。それに対して、本手法で可能になる動的タイム・ボローイングは、動作時に、ステージ間で回路遅延を融通することができる。しかも、融通される遅延は、ワースト遅延ではなく、実効遅延である。

動的タイム・ボローイングの結果、複数ステージ間に渡る多段のパスが形成され、プロセスばらつきの影響が軽減される。さらに、ワースト遅延ではなく、ワースト遅延より大幅に短い実効遅延に基づく動作が可能となる。その最大動作周波数は、TF の検出限界によって決まり、それは従来のクロッキング方式の 2 倍になる。

以下、2 章では、今回特に考慮するばらつきである入力ばらつきについて取り上げ、実際の回路遅延は実効遅延で決定されることを示し、さらに様々な既存のクロッキング方式のタイミング制約を述べたうえで、そのばらつき耐性について議論を進める。3 章で提案手法の構成・動作を示す。4 章では、提案手法の適用を自動化する変換ツールの実装を説明する。5 章では、変換ツールを用いて比較的簡単な回路を提案手法化する。

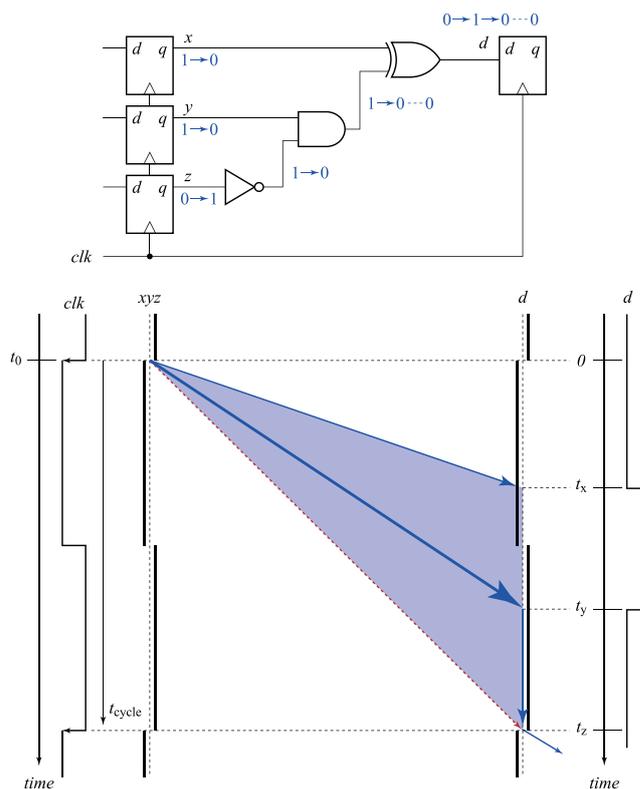


図 2 複数のパスを持つ回路

2. 入力ばらつきと既存のクロッキング方式

本章では、入力ばらつきと既存のクロッキング方式について述べる。

2.1 t-diagram と 入力ばらつき

図 2 (上) の回路において、信号が伝わる様子を同図 (下) に示す。このチャートを我々は、タイミング・ダイアグラムと呼んでいる。以下、t-diagram と表記する。通常のタイム・チャートが論理値-時間の 2 次元を持つに対して、t-diagram は時間-空間の 2 次元を持つ。

通常のタイム・チャートでは、右方向が時間を、上下方向が論理値を表す。タイム・チャートは、論理値の時間的変化を表現するが、1 本の波形で表すことができるのは回路の特定の 1 点の振る舞いに限られる。複数の点にまたがる動きを把握するためには、複数の波形を並べなければならない。

それに対して t-diagram は、下方向が時間を、右方向が回路中を信号が伝わって行く方向を表し、時間の経過につれて信号が伝わっていく様子を俯瞰することができる。図 2 (上) に示す回路で、時刻 $t = 0$ に 3 つの FF の出力 (x, y, z) が $(1, 1, 0)$ から $(0, 0, 1)$ に遷移したとする。 x, y, z から d に至るパスの遅延をそれぞれ t_x, t_y, t_z とすると、ロジックの出力 d は、時刻 t_x, t_y において $0 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ と遷移する。 z から d に至るパスの信号は、 y から d に至るパスの信号によって変化がマスクされるため、時刻 t_z には

出力は変化しないことに注意されたい。

同図の右端にある波形が、 d における通常のタイム・チャート（を右に 90° 回転したもの）である。同図のように t -diagram では、ロジックの入力において入力に変化した時刻から、出力において出力が変化した時刻までを直線矢印で結ぶことによって、信号の伝わる様子を表すことができる。

なお t -diagram では、各ステージのクリティカル・パスに対応する直線矢印の角度を 45° としている。こうすることによって、各ステージの遅延は、 t -diagram 上のステージの横幅によって表現することができる。実際のロジックではパスが無数に存在するため、ロジック上の全遅延の存在領域は、ロジック内の最小遅延のパスとクリティカル・パスに囲まれた領域に網掛けすることにより示す。

実効遅延

前述したように、 z から d に至るパスの信号は、出力 d に影響を与えない。実際にパスを通ったシグナルがロジックの出力に影響を与えたことを、そのパスが**活性化**したと言う。 t -diagram では活性化されたパスを実線で表す。反対に、活性化パスにより、変化が**マスク**され、ロジックの出力に影響を及ぼさないパスは点線で表す。

あるステージにおいて最後に活性化されたパスの遅延を、このステージの**実効遅延**と呼ぶことにする。

ロジックのパスは無数に存在するが、すべてのパスを伝わる信号が出力に影響を及ぼすわけではない。 t -diagram では実効遅延を決めるパスを太実線で表す。図2の場合、時刻 t_z においてクリティカル・パスを通った信号が到達しているが、活性化パスによって変化がマスクされているため、ロジックの出力 d は変化しない。この場合、実効遅延は t_y となる。

各ステージへの入力と 1 サイクル前の入力によって出力の変化の仕方は様々であり、どのパスが最後に活性化されるかは各サイクルごとに異なる。つまり実効遅延は入力によっても変化する。これを**入力ばらつき**と呼ぶ。特に、ロジックの出力が直前のサイクルと同じで、1 度も変化しなかった場合には、実効遅延は 0 となることに注意されたい。

2.2 既存のクロッキング方式

同期式順序回路を構成する方法を**クロッキング方式**という。また、ロジックのパスの遅延がどこまで許容できるかの制約を**タイミング制約**と呼び、これを満たすように設計しなければ、回路が正しく動作しない。本章ではさまざまなクロッキング方式のタイミング制約を示し、そのばらつき耐性について議論を進める。

2.2.1 単相 フリップ・フロップ

図3左が、単相 FF 方式の t -diagram である。マスター・スレーブ型の FF は逆相で動くラッチを 2 つ組み合わせる構

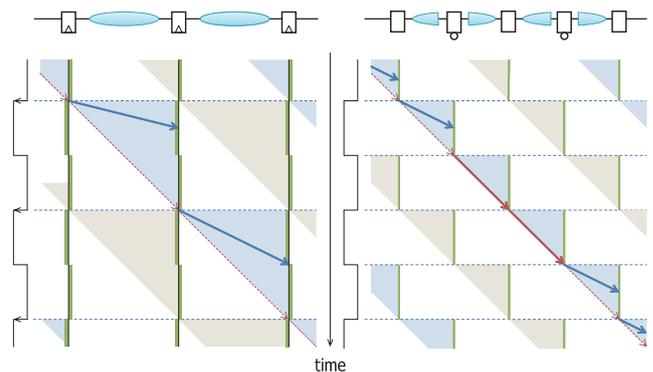


図3 単相 FF(左)と二相ラッチ(右)の t -diagram

造をとる。

同図において、FF の下にある実線は、ラッチが閉じている状態を表している。信号の線がこの実線に沿って伝う様子は、その間ラッチが値を保持していることを表す。エッジ・トリガ動作は、マスター・スレーブを互い違いに記述することで生じる隙間からシグナルが伝播する様子で表すことができる。

クロックの立ち上がりまでに信号が間に合っていればよいので、最大遅延制約は $1\text{cycle}/1\text{stage}$ となる。

2.2.2 二相ラッチ

図3右が、二相ラッチ方式の t -diagram である。二相ラッチは、FF を構成する 2 つのラッチ（マスター、スレーブ）のうちの 1 つを、ロジックのちょうど中間に移動したものと理解することができる。単相 FF 方式の 1 ステージに相当するロジックをラッチが二分する形になる。

この形式はクロックスキューに対しても高い耐性もあることが知られている [3]。

2.2.3 静的タイム・ボローイング

図4はステージ間の遅延に偏りがある場合の単相 FF 方式(左)と二相ラッチ方式(右)の t -diagram である。

単相 FF 方式では常にラッチが閉じている状態のため、仮にクロックの立ち上がりより前にシグナルが到達していても、シグナルが次のステージに伝播するタイミングがクロックの立ち上がる瞬間に限定されているため、ステージごとに時間を融通できない。そのため、遅延が大きいステージによってワースト遅延が定まるため、遅延の小さいステージではサイクル・タイムに無駄が生じてしまう。

二相ラッチ方式では、単相 FF 方式の 1 ステージに相当するロジックが 2 分されており、ロジックを通過する時間をステージ間で融通することができ、その結果サイクル・タイムが短縮できる。このように、前後のステージ間で時間を融通する手法を**タイム・ボローイング**と言う。後述する提案手法の**動的タイム・ボローイング**と区別するため、この設計時におけるタイム・ボローイングを**静的タイム・ボローイング**と呼ぶ。

これにより、二相ラッチの遅延制約は累積で 0.5cy-

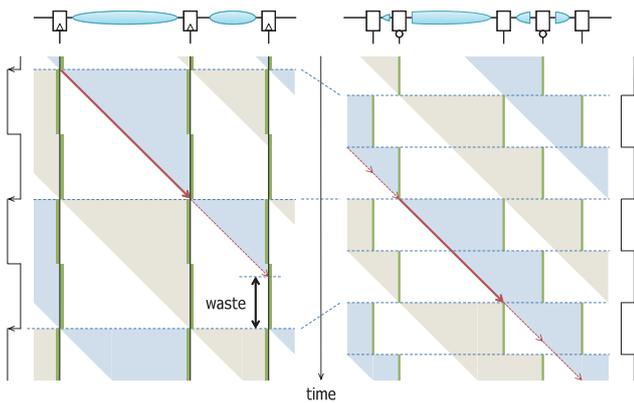


図 4 静的タイム・ボローイング

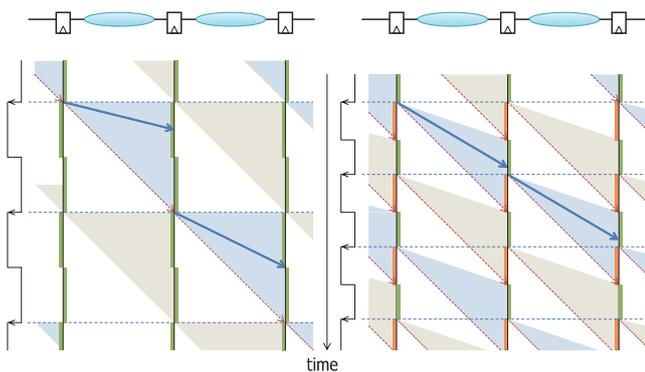


図 5 単相 FF (左) と Razor FF (右) の t-diagram

clk/0.5stage, 最大遅延制約は 1cycle/0.5stage となる。

2.2.4 Razor FF

図 5 右は Razor FF の t-diagram である。

Razor FF は通常の FF(Main FF) に、Shadow Latch が加えられている。Shadow Latch には、Main FF よりも遅れたクロックが供給されていて、サンプリング・タイミングが遅くなっている。図 5 では、0.5cycle 遅らせたクロックを Shadow Latch に供給している。このため、TF が発生して Main FF のサンプリング・タイミングまでにクリティカル・パスのシグナルが到達しなくても、Shadow Latch はクリティカル・パスの値をサンプリングすることができる。Main FF と Shadow Latch の値を比較することで、TF を検出する。

2.2.5 Razor FF のショート・パス問題

クリティカル・パスのおおむね半分以下の遅延を持つパスをショート・パスと呼ぶ。セットアップ/ホールド・タイム違反など、ショート・パスの活性化が原因でロジックのタイミング制約が満たされない問題をショート・パス問題と呼ぶ。

図 6 は Razor FF のショート・パス問題を図示した t-diagram である。Razor FF は、Main FF と Shadow Latch の値を比較することで TF を検出するが、正しい値をサンプリングするためには、ロジックのショート・パスを通ったシグナルが Shadow Latch のサンプリング・タイミング

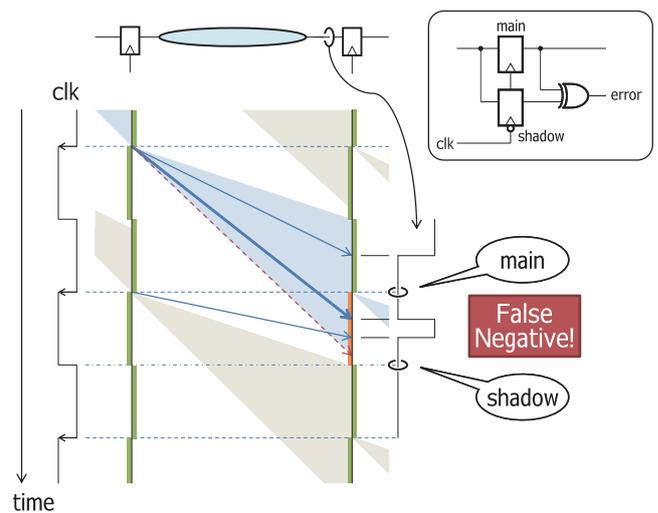


図 6 Razor FF の回路構成とショート・パス問題

よりも後に到達するように設計しなくてはならない。さもないと、次のサイクルでショート・パスを通ったシグナルが前サイクルの遅れたシグナルと混ざり、Shadow Latch のサンプリング・タイミングで Shadow Latch が正しい値をサンプリングできず、エラー信号が正しく出力できない。

図 6 の場合では、Shadow Latch のサンプリングは 0.5cycle 遅れて行われているので、ロジックの最小遅延が 0.5cycle 以上になるように、Shadow Latch に至るパスの遅延を 0.5cycle 以上にするなどの細工が必要である。このために、例えばショート・パスに遅延素子を挿入し、遅延を伸ばす方法がある。

Razor FF の遅延制約は、検出ウィンドウの割合を α とすると、最大遅延制約は $(1 + \alpha)$ cycles/1stage となり、TF 検出制約は最大 1cycle/1stage となる。

3. 提案手法

本章では、二相ラッチ方式と TF 検出を組み合わせせたクロッキング方式を提案する。これにより、動的タイム・ボローイングが可能になる。

3.1 回路構成

図 7 は提案手法の回路構成である。図 7 上は二相ラッチの回路の概略図である。ロジックのショート・パスとクリティカル・パスがとあるゲート (図中○印) で合流した後、パイプライン・ラッチに接続されている。

図 7 下は提案手法の回路の概略図である。TF 検出のために、各パイプライン・ラッチに Razor-like な処置を施す。逆相で動作する Shadow Latch と比較器としての XOR ゲートを追加する。ここでは便宜上、Razor Latch と呼ぶことにする。

2.2.5 で述べた Razor のショート・パス問題が起きないように、ロジックに遅延を挿入する。TF 検出時は Shadow

Latchが開き、Main Latchが閉じている状態であり、Main Latchは前サイクルの値を保持しているため、次サイクルのショート・パスの活性化の影響を受けない。このことから、ショート・パスとクリティカル・パスの合流するゲートを二重化し、Shadow Latchに至るショート・パスにのみ遅延を挿入する。Main Latchに至るショート・パスには遅延が挿入されていないので、ロジックの遅延分布がクリティカル・パスの遅延の方に偏る心配もない。

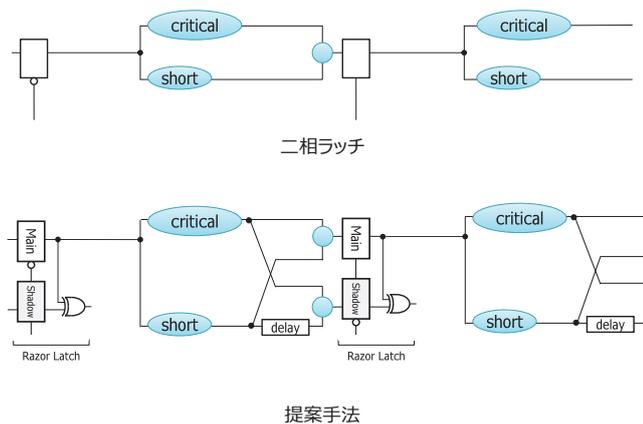


図7 提案手法の回路構成

3.2 動的タイム・ボローイング

図8は、二相ラッチ方式と提案手法のt-diagramを比較したものである。図中実線は各ステージにおいて遅延の同じパスが活性化していることを示している。

最近の商用のプロセッサでは、ステージ間のクリティカル・パスの遅延は均等になるように作られているため、2.2.3で述べた静的タイム・ボローイングの効果は実際には限定的なものであると言える。

通常の二相ラッチ方式はTF検出が備わっていないために、ラッチの開く瞬間の部分でワーストを定めねばならない。そのため、ロジック上の全遅延の存在領域は図の網掛けした部分に限られ、実際には静的タイム・ボローイングを可能にしていたラッチの空いている領域をうまく利用できていない。結果、FF方式と同様ステージ間の時間を融通できていないこととなる。

提案手法ではTF検出により、ラッチの開く瞬間ではなく、検出限界までワーストを定めることができ、ロジック上の全遅延の存在領域をラッチの空いている区間にも広げることが可能となる。

これにより、動作周波数が向上しているにもかかわらず、実効遅延を累積させて回路を動作させることが可能となる。実行遅延を融通させるこの時間の貸し借りのことを、動的タイム・ボローイングと呼ぶ。

t-diagram上では実線につながってステージ間を伝播する様子で動的タイム・ボローイングの効果を表すことがで

きる。

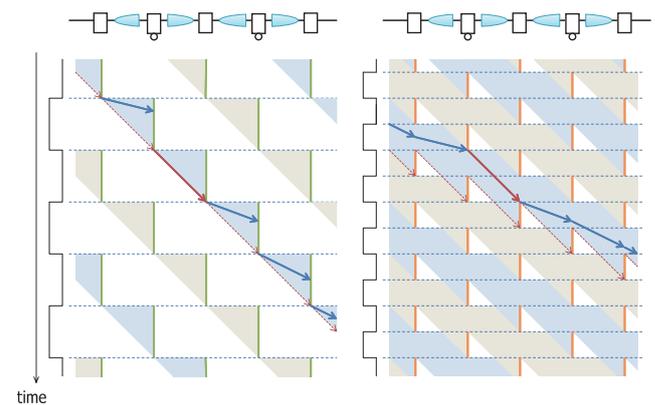


図8 二相ラッチ(左)と提案手法(右)のt-diagram

3.3 Razorと提案手法の比較

動的タイム・ボローイングの効果はRazorと比較することで、さらに明確なものになる。図9はRazorと提案手法のt-diagramである。

RazorはFF方式のタイミング・フォールト検出回路であるため、タイム・ボローイングができず、検出ウィンドウにかかるパスが活性化した場合、その時点で必ずタイミング・フォールトを起してしまう。タイミング・フォールトが検出されるごとに命令再実行などの回復処理が行われるため、その回復オーバーヘッドは無視できないものとなる。

提案手法では、遅延の大きいパスが連続して活性化した時にのみTF検出となるように設計されている。動的タイム・ボローイングにより、あるステージでクリティカル・パスのような遅延の大きいパスが活性化したとしても、その前後のステージを遅延の小さいパスで通過させることでタイミング・フォールトの発生を抑えることができる。

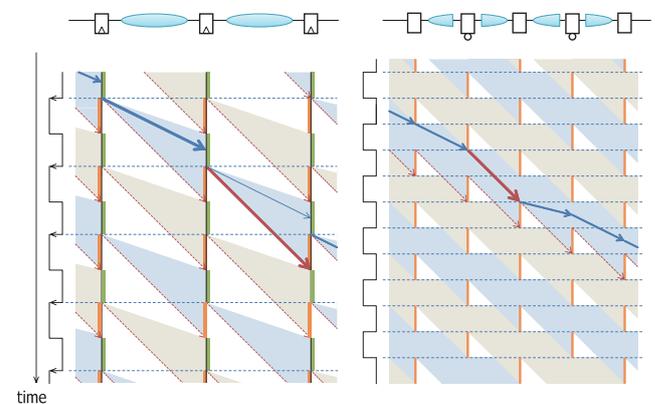


図9 Razor(左)と提案手法(右)のt-diagram

表 1 既存のクロッキング方式との比較

	ワーストケース設計	動的 TF 検出・回復	
	最大遅延制約	最大遅延制約	TF 検出制約
単相 FF	ワースト遅延 各ステージ: 1τ [普通]	ワースト遅延 各ステージ: $(1 + \alpha)\tau$	実効遅延 各ステージ: 1τ [Razor]
二相 ラッチ	ワースト遅延 累積の平均: 1τ [静的タイム・ホローイング]	ワースト遅延 各ステージ: 2τ	実効遅延 累積の平均: 1τ [動的タイム・ホローイング]

3.4 既存のクロッキング方式との比較

表 1 は、単相 FF、二相ラッチ、Razor FF、そして提案手法のタイミング制約をまとめたものである。単相 FF 方式の動作周波数を 1τ とし、各ステージのクリティカル・パスの遅延は均等であるとする。

単相 FF 方式は「ワースト遅延のワースト」で動いているといえよう。

二相ラッチ方式は実際には実効遅延の累積で動作させることが可能である。しかし、クリティカル・パスが活性化された際の保障がないため、「ワースト遅延の累積」で設計せざるをえない。

Razor FF は、TF 検出によりワーストが検出限界ギリギリに到達することを許す方式であるから、「一番長いステージのクリティカル・パスの活性化を許すが、検出限界を超えない」ようにワースト値を設計できる。そのため実効遅延での動作が可能となり、Razor FF は「実効遅延のワースト」で動いていると言える。

提案手法は、その TF 検出を二相ラッチ形式に適用したものである。「実効遅延の累積」で回路を動かすことが可能になり、またステージが二分され、その半分のロジックのクリティカル・パスが検出限界を超えないように設計できるので、理論上は単相 FF の半ロジック分の動作周期、すなわち 2 倍の動作周波数を実現できるのである。

4. 変換ツール

以前我々は、リプルキャリー・アダーを用いたアップカウンタに対して提案手法を適用した [4]。このような手作業での提案手法の適用を行うためには、回路のすべてのパスの遅延を考慮する必要があり、より複雑な回路への適用は困難である。そこで我々は EDIF で記述された回路を提案手法を適用した回路に変換するツールを作成した。

4.1 EDIF

EDIF とは電子回路のネットリストを記述する標準的なフォーマットである。EDIF は S 式によって記述されている。EDIF 形式のファイルを読み込み、回路に提案手法を適用した後に再び EDIF 形式として出力する。このツールでは、出力の EDIF を Xilinx の ISE で読み込んで FPGA 上で動作させることを目標とする。

4.2 二相ラッチ化

二相ラッチ化するためには、ロジックの間に逆相のラッチを挟むことで、ロジックを二分する必要がある。まずロジックのクリティカルパスの遅延を求める。パラメータが負の値を取ることのできる最短経路探索アルゴリズムである BellmanFord 法によって各 LUT 素子の入力からのクリティカル・パス遅延を求める。遅延がクリティカルパスの遅延の二分の程度になるネットでロジックを 2 分割し、そこにラッチを挟むことで、ロジックを二相ラッチ化する。

4.3 Razor の挿入

このように二相ラッチ化した回路のそれぞれのラッチについて、クリティカルパスの遅延の二分の一以上の遅延を持つパスに接続されているものを Razor ラッチへ変更する。

4.4 遅延の挿入

Razor のショート・パス問題を回避するために、ショート・パスに遅延を挿入する必要がある。Razor の Shadow Latch につながるすべてのパスが、少なくともクロック周期の 2 分の 1 以上の遅延を持つように遅延素子を入れる。

CP 遅延の半分を D_{th} とする。先ほどと同様に、Bellmanford によって入力からのショート・パスとクリティカル・パスを求める。あるゲート G に対して、ショート・パスを $SP[G]$ 、クリティカル・パスを $CP[G]$ 、出力ポートからの距離 $D[G]$ 、このゲートの遅延を $d[G]$ とする。

1. ある出力ポート P に対して $CP[P] > D_{th}$ ならば Razor の挿入が必要。そうでなければ、ここは普通のラッチで良い。

2. $SP[P] < D_{th}$ の時はショート・パスに遅延を入れる必要がある。

3. Razor につながるゲートに対してクリティカル・パスが伸びないように、ショート・パスを増やす。すなわち、このゲートの入力につながるあるゲートを G_p とし、そのネット $Net(G_p, G)$ に対して $D_{th} - SP[G] - D[G_p] + d[G]$ の遅延を挿入する。ただし、 $D_{th} - SP[G] - D[G_p] + d[G] > CP[G_p] - CP[G] + d[G]$ の時は CP の遅延が増加してしまうので、 $CP[G_p] - CP[G] + d[G]$ だけ遅延を挿入して、残りは更に前のゲートに同様の処理をおこなって挿入する。

5. キャリールックアヘッド・アダーへの適用と評価

この変換ツールを用いてキャリールックアヘッド・アダー (CLA) への提案手法の適用と評価を行う。CLA へ提案手法を手作業で適用すると、図 10 のようになる。しかし、実際に VerilogHDL で記述した CLA を論理合成ツールで EDIF に変換すると、最適化によって人間にはわかりにくい回路になる。例えば 8bit の CLA は図 11、64bit の CLA は図 12 のようになる。8bit 程度ならば人間が理解す

表 2 遅延素子や Razor の数

	8bit CLA	64bit CLA
LUT	12	215
Delay	12	808
Razor	7	56

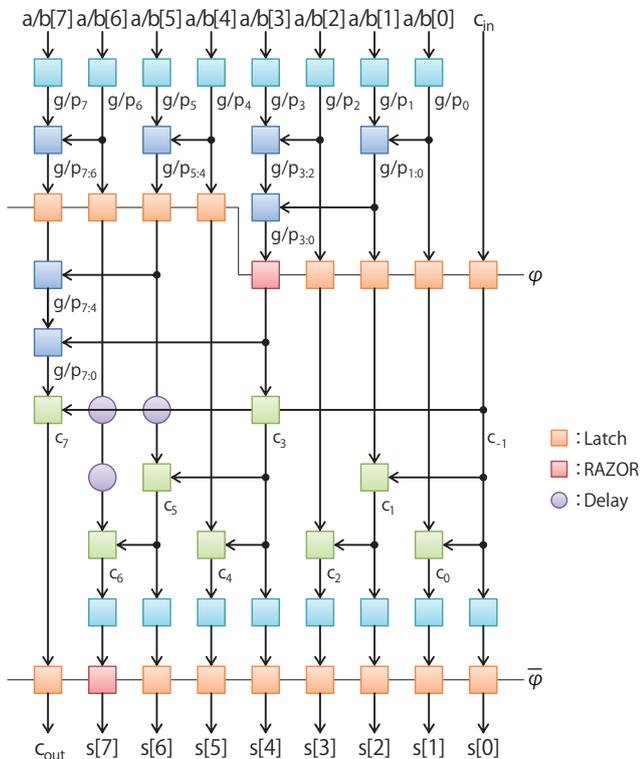


図 10 CLA への適用

ることができるが、64bit にもなるとほぼ不可能である。このように複雑な回路でもこの変換ツールを用いれば提案手法を適用できるようになる。

5.1 評価

Xilinx ISE Design Suite 13.3 によって Virtex6 xc6vtx760-2ff1760 をターゲットとして Verilog HDL で記述した CLA を EDIF に変換し、これを変換ツールへの入力とした。変換ツールで遅延素子を挿入した後の Razor や遅延素子の数の測定を行った結果、表 2 のようになった。

6. おわりに

本稿では、二相ラッチと Razor を組み合わせることにより動的タイム・ボローイングを可能にするクロッキング方式を提案した。ステージ間でワースト遅延ではなく実効遅延を融通することができ、さらに Razor により、半ロジックのクリティカル・パス遅延で動作周波数を決定できるため、従来の単相 FF 方式と比べて最大で 2 倍の動作周波数で動作させることが可能となる。この提案手法を回路に対して自動的に適用するためのツールの実装方法について説明した。今後はこのツールを用いて提案手法を適用した FPU

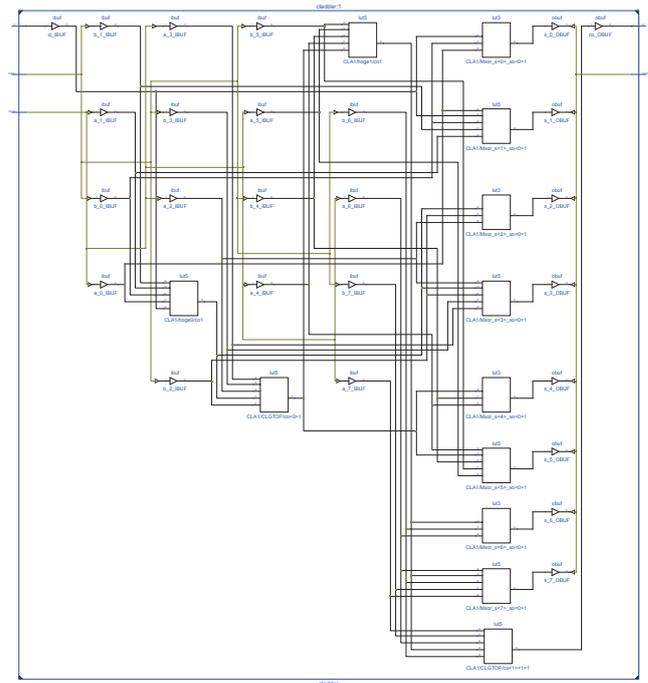


図 11 CLA

やプロセッサなどを実装して評価していく予定である。

謝辞 本論文の研究は、一部 JST CREST 「ディペンダブル VLSI システムの基盤技術」「アーキテクチャと形式的検証による超ディペンダブル VLSI」による。

参考文献

- [1] D.Ernst, N.Kim, S.Das, S.Pant, T.Pham, R.Rao, C.Ziesler, D.Blaauw, T.Austin, and T.Mudge. Razor: A low-power pipeline based on circuit-level timing speculation. In *Int'l Symp. on Microarchitecture (MICRO)*, pp. 7–18, 2003.
- [2] 喜多貴信. タイミング制約を緩和するクロッキング方式. 東京大学修士論文, pp. 19–24, 2010.
- [3] David Harris. Skew-tolerant circuit design. *Morgan Kaufmann Publishers*, pp. 12–14, 2001.
- [4] 吉田宗史, 有馬慧, 倉田成己, 塩谷亮太, 五島正裕, 坂井修一. 動的タイムボローイングを可能にするクロッキング方式の予備実験. 信学技報, 第 111 巻 of *CPSY2011-11*, pp. 13–18, 鹿児島, 7月 2011. 2011 年 7月 27日 (水) – 7月 29日 (金) かごしま県民交流センター (DC, CPSY).
- [5] D. Blaauw, S. Kalaiselvan, K. Lai, Wei-Hsiang Ma, S. Pant, C. Tokunaga, S. Das, and D Bull. Razor ii: In situ error detection and correction for pvt and ser tolerance. In *Int'l Symp. on Solid-State Circuits Conference (ISSCC)*, 2008.
- [6] D. Bull, S. Das, K. Shivshankar, G. Dasika, K. Flautner, and D. Blaauw. A power-efficient 32b arm isa processor using timing-error detection and correction for transient-error tolerance and adaptation to pvt variation. In *Solid-State Circuits Conference Digest of Technical Papers (ISSCC), 2010 IEEE International*, pp. 284 –285, feb. 2010.
- [7] 佐藤寿倫. カナリア・フリップフロップを利用する省電力マイクロプロセッサの評価. 先進的計算基盤シンポジウム SACSIS, pp. 227–234, 2007.
- [8] Y. Kunitake, T. Sato, H. Yasuura, and T. Hayashida. A



図 12 CLA

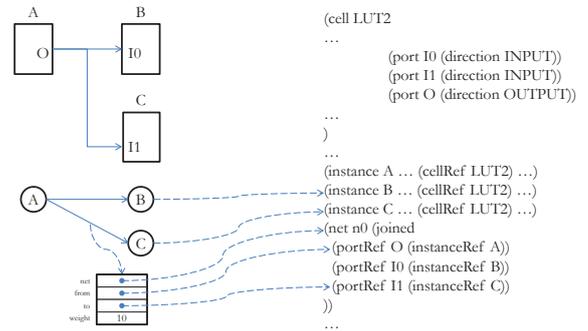


図 13 グラフへの変換

Statistical analysis and optimization for vlsi: Timing and power. ISBN: 978-0-387-25738-9, 2005.

- [14] Thucydides Xanthopoulos. *Clocking in Modern VLSI Systems*. Springer Publishing Company, Incorporated, 1st edition, 2009.

selective replacement method for timing-error-predicting flip-flops. In *Circuits and Systems (MWSCAS), 2011 IEEE 54th International Midwest Symposium on*, pp. 1–4, aug. 2011.

- [9] M. Choudhury, V. Chandra, K. Mohanram, and R. Aitken. Timber: Time borrowing and error relaying for online timing error resilience. In *Design, Automation Test in Europe Conference Exhibition (DATE), 2010*, pp. 1554–1559, march 2010.
- [10] 有馬慧, 岡田崇志, 塩谷亮太, 五島正裕, 坂井修一. 過渡故障耐性を持つ out-of-order スーパスカラ・プロセッサ. 信学技報, 第 111 巻 of *CPSY2011-5*, pp. 23–28, 東京, 4 月 2011. 2011 年 4 月 12 日 (火) 首都大学東京秋葉原サテライトキャンパス (DC, CPSY).
- [11] 平本俊郎, 竹内潔, 西田彰男. Mos トランジスタのスケールリングに伴う特性ばらつき. 電子情報通信学会誌, 第 92 巻, 2009.
- [12] 五島正裕. デジタル回路. 数理工学社, 2007.
- [13] Srivastava Ashish, Sylvester Dennis, and Blaauw David.